فصلنامه علمي يژوهشي

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد

ma.iaumajlesi.ac.ir

یهینهسازی خواص مکانیکی و دیالکتریک بهوسیله کنترل تراکم پذیری و ریزساختار در سرامیکهای نیترید سیلیسیم تهیه شده به روش پرس داغ

> سيد سلمان سيد افقهي"، اميرحسين كوچكي فروشاني ، يوريا دهقاني ، فرهود حيدري ً ۱ - دانشیار، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران. ۲- دانشجوی دکتری، رشته مهندسی مواد، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، البرز، ایران. ۳- دانشجوی دکتری، رشته مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران. ۴- پژوهشگر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران. salmanafghahi@gmail.com*

اطلاعات مقاله
دریافت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
کلید واژگان:
پرس داغ
تفجوشى
خواص مکانیکی
دىالكتريک
نيتريد سيليسيم

Optimization of Mechanical and Dielectric Properties by Controlling Densification and Microstructure in Silicon Nitride Ceramics Prepared by Hot Pressing Method

Seyed Salman Seyed Afghahi^{1*}, Amirhossein Kouchaki Foroshani^r, Pouria Dehghani^r, Farhood Heydari^r

1- Associate Professor, Faculty of Engineering, Imam Hossein University, Tehran, Iran.

- Y- Ph.D. student, Department of Ceramic, Materials and Energy Research Center, Karaj, Alborz, Iran.
- r- Researcher, Faculty of Engineering, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
- [£]- Ph.D. student, Researcher at Advanced Materials and Nanotechnology Research Center, Imam Hossein University, Tehran, Iran.

* salmanafghahi@gmail.com

T. 1... 1. TETTTTT. 1E.T. 1V.T.T.

Article Information Original Research Paper

Abstract

Silicon nitride ceramics are materials with excellent mechanical, dielectric and thermal properties, which with such properties is one of the main candidates for use in high temperature environments. In this study, the effect of sintering temperature on microstructure control and densification and optimization of mechanical and dielectric properties of silicon nitride ceramics prepared by hot pressing at different temperatures of Vov. °C,

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

Please cite this article using:

Seyed Salman Seyed Afghahi, Amirhossein Kouchaki Foroshani, Pouria Dehghani, Farhood Heydari, Optimization of Mechanical and Dielectric Properties by Controlling Densification and Microstructure in Silicon Nitride Ceramics Prepared by Hot Pressing Method, New Process in Material Engineering, Y-YP, 19(P), 17-YP.

مقاله يژوهشي

Keywords: Hot Press Sintering Mechanical Properties Dielectric Silicon Nitrid

۱- مقدمه

در طی سالهای اخیر، نسلهای جدیدی از سرامیکها توسعه یافته است و انتظار میرود با توجه به روند رو به رشد آنها، استفادههای وسیعی در حوزه کاربردهای ساختاری دما بالا پیدا کنند. نیترید سیلیسیم یک مادهی سازهای شناخته شده با خواص منحصربهفرد مانند استحکام بالا، چقرمگی شکست بالا و مقاومت در برابر اکسیداسیون مناسب، یکی از کاندیدهای اصلی جهت کاربرد در شرایط محیطی دما بالا با حفظ خواص مکانیکی و فیزیکی خود است [۱–۳]. با این حال، تفجوشی سرامیکهای نیترید سیلیسیم به دلیل پیوندهای کووالانت قوی و سرعت آهسته نفوذ ماده مشکل است، بنابراین استفاده از افزودنیهای تفجوشی مانند است، بنابراین استفاده از افزودنیهای تفجوشی مانند آهسته خوری هستند مشکل جار بیوندهای کووالانت قوی و سرعت آهسته نفوذ ماده مشکل است، بنابراین استفاده از افزودنیهای تفجوشی مانند است، عرباری میرامیکهای نیترید سیلیسیم خروری هستند آهستا تسریع چگالش سرامیکهای نیترید سیلیسیم ضروری هستند آه-۷].

در طول دهههای گذشته، از چندین روش تفجوشی به همراه فشار جهت دستیابی به سرامیکهای نیترید سیلیسیم با خواص بهینه استفاده شده است. حوزه فناورانه تحقیقاتی در این سرامیکها عمدتاً بر پایه: (۱) ساخت سرامیکهای نیترید سیلیسیم متراکم به همراه فشار که می تواند به وسیله فر آیند پرس داغ ('HP)، سینتر پلاسمای جرقهای ('SPS) و پرس ایزواستاتیک داغ (HIP^۳) انجام شود و یا (۲) ساخت سرامیکهای نیترید سیلیسیم متخلخل بهوسیله فرآیند پیوند واکنشی پودر فشرده شده سیلیکون بوده است. سرامیک نيتريد سيليسيم تهيه شده بهوسيله هر دو اين روشها به دليل وجود تفاوت در میزان چگالی، دارای ساختار دو وجهی متمایز و در نتیجه دارای خواص حرارتی، مکانیکی و ترمومکانیکی متفاوتی است [۴، ۸–۹]. با توجه به نتایج پژوهشهای انجام شده در زمینه تفجوشی سرامیکهای نيتريد سيليسيم و خواص مكانيكي و دىالكتريك مطلوب قطعات تفجوشی شده توسط فرآیند پرس داغ [۱۰ و ۱۳] در مقایسه با نتایج سایر روشها مانند تفجوشی بدون فشار

[۱۳–۱۲] و سینتر پلاسمای جرقهای [۱۴–۱۵]، روش پرس داغ بهعنوان فر آیند تفجوشی انتخاب شد. در پژوهش لیو و همکارانش[†] [۱۶] سرامیکهای نیترید سیلیسیم بهوسیله فر آیند پرس داغ در دمای °°°۰۸ و به کمک درصد افزودنیهای مختلف $γ_{v}$ تهیه شدند. این سرامیکها دارای خواص مکانیکی شامل سختی ۱۸٬۳۷ GPa به تحکام خمشی در حدود GPa ۱/۱، خواص دی الکتریک شامل ثابت در ایکتریک ۸/۸ و اتلاف دی الکتریک زیر ۱۰/۰ بوده است. در پژوهشی دیگر کیانگ و همکارانش⁶ [۱۷] به بررسی تأثیر مشخصات پودر اولیه بر روی رفتار تف جوشی، ریز ساختار و نیرداختند. مشخص شد که: ۱) اندازه ذرات پودر اولیه دلیل پرداختند. مشخص شد که: ۱) اندازه ذرات پودر اولیه دلیل اصلی در افزایش اندازه دانه β/۹ است و ۲) نسبت فاز افزایش خواص مکانیکی خواهد شد.

در طول فر آیند سینترینگ، در ابتدا پودرهای ۲۰۳۰-۵۰ در فاز مایع ایجاد شده ناشی از واکنش افزودنیهای تفجوشی و لایه SiQ۲ سطحی ذرات نیترید سیلیسیم حل شده و پس از آن دانههای ۲۰۳۶-β رسوب می کند. دانههای کشیده شده ۲۰۶۰-β از نظر ریزساختار مشابه الیاف تقویت کننده بوده و ساختار را مستحکم می کند، به طور مشخص می توان گفت ساختار را مستحکم می کند، به طور مشخص می توان گفت خواص سرامیک ۶۱۳N۶-β به شدت وابسته به ریزساختار است استد طول، عرض و نسبت طول به عرض دانههای کشیده شده به طور مستقیم بر روی خواص مکانیکی سرامیکها تأثیر گذار هستند. طراحی ریزساختاری یک فاکتور کلیدی در بهینه سازی پارامترهای تفجوشی و خواص مکانیکی سرامیکهای نیترید سیلیسیم است.

پرس گرم نیترید سیلیسیم یکی از منحصربهفردترین فرآیندها برای تولید سرامیکهای نیترید سیلیسیم با چگالی نزدیک به تئوری است، در این فرآیند اعمال فشار باعث بهبود فرآیند نفوذ فاز مایع درون دانههای ۹-Si_rN و تبدیلات فازی

 α -Si₂N 1000 • β -Si₃N₄ 800 Intensity (a.u) 600 400 200 0 -10 20 30 40 50 60 70 80 Position [2Theta] شکل (۱): الگوی پراش حاصل از پودر نیترید سیلیسیم اولیه.

در مسیر ساخت نمونه های سرامیکی، در ابتدا پودر نیترید سیلیسیم با ۹/۹٪ وزنی کمک تفجوش ایتریا توزین شد. پودرهای توزین شده به منظور فعال سازی سطحی تحت فرآیند آسیاکاری مکانیکی در اتمسفر گاز نیتروژن به مدت ۱۲ ساعت قرار گرفتند، در این فرآیند از اتانول به عنوان محیط آسیاکاری استفاده شد، فرآیند خروج رطوبت نیز به کمک دستگاه خشک کن در دمای ۲°۸۰ به مدت ۲۴ ساعت انجام شد. همچنین، به منظور حذف آگلومره های نرم تولید شده در حین فرآیند رطوبت زدایی پودر از الک مش عبور داده شد.

تفجوشی نمونه ها به وسیله دستگاه پرس داغ (ساخت شرکت خلأ پوشان) و با استفاده از قالب های استوانه ای شکل گرافیتی انجام شد. جهت جلوگیری از نفوذ کربن به درون پودر از کاغذهای گرافیتی ایزوله کننده پودر استفاده شد. تفجوشی در بازه دمایی ۲°۵۰۰۱–۱۸۰۰ با نرخ حرارت دهی ۲۰۵۱° و مدت نگه داری در بیشینه دما ساعت، تحت اتمسفر نیتروژن با فشار پرس ۳۹MP انجام شد [۳۳]. سیکل سرمایش نمونه ها از دمای تف جوشی تا دمای محیط مطابق سرعت حرارت دهی در نظر گرفته و در نهایت قطعات تف جوشی شده به شکل قرص های با قطر ۳۰ میلی متر ساخته شدند که از فرآیند پولیش زنی برای حذف می شود. همان طور که مشخص است مقدار رشد دانه ناهمسانگرد و کسر حجمی دانه های کشیده شده β-SirNε می تواند به وسیله دمای واکنش بهبود یابد [۲۱–۲۳]. در این پژوهش، اثر دمای تف جوشی بر روی دانه های ۶۱rN۶β از منظر مور فولوژی، استحکام مکانیکی و خواص مخابراتی مورد بررسی قرار گرفته است، بهبود شرایط و فرآیند تف جوشی سرامیک های نیترید سیلیسیم به وسیله بهینه سازی دمای سینترینگ و دستیابی به بالاترین خواص مکانیکی و دی الکتریک با توجه به اثر فشار و دما و تشکیل و نفوذ فاز مایع تف جوشی به واسطه فشار فرآیند پرس گرم از نقاط نو آورانه این پژوهش است.

۲- مواد و روش تحقیق ۲-۱- مواد اولیه و روش انجام آزمایش

در شکل ۱ الگوی پراش پرتوایکس حاصل از پودر نیترید سیلیسیم خریداری شده ارائه شده است. آنالیز عنصری (ICP) پودر نیترید سیلیسیم نشان داد که این پودر حاوی ناخالصیهایی با درصدهای ارائه شده در جدول ۱ است و از نظر فازی دارای ۹۵/۶٪ فاز آلفا و ۴/۴٪ فاز بتا است.

جدول (۱): آنالیز عنصری ICP از پودر نیترید سیلیسیم خریداری شده.

آهن	كلسيم	پتاسيم	کلر	آلومينيوم	نوع ناخالصي	
1.	١	۴	v	10	مقدار برحسب	
					ppm	

در جدول ۲ مشخصات مواد اولیه استفاده شده در پژوهش حاضر ارائه شده است.

جدول (۲): مشخصات مواد اولیه استفاده شده در پژوهش.

شرکت سازنده	کش <mark>و</mark> ر سازنده	خلوص (٪)	اندازه ذرات (μm)	نام ماده
شرکت Luoyang	چین	+99	•/۵	نیترید سیلیسیم
شرکت ایلیا صنعت	ايران	+99	>۴	ا کسید ایتر یا

گرافیت نفوذ کرده بر روی سطح آنها استفاده شد. در جدول ۳ دماهای تفجوشی و مشخصات نمونهها ارائه شده است.

جدول (۳): دماهای تفجوشی نمونههای ساخته شده بهوسیله فر آیند .

داع.	پرس

دمای تفجوشی (C°)	نمونه	
10	Y8.0T1.0	
18	Y9.5T1.9	
14	Y9.5T1.Y	
18	Y9.5T1.A	

۲-۲- مشخصه یابی

چگالی نمونهها بر اساس فرآیند ارشمیدس و مطابق با استاندارد ASTM C۳۷۳ مورد محاسبه قرار گرفته است. برای شناسایی و بررسی فاز بلورین، از دستگاه پراش پرتوایکس مدل "Philips PW۳۷۱۰" استفاده شد. زاویه ۲θ در این آزمون در بازه ۱۰ تا ۸۰ درجه و با تابش CuKα با طول موج ۱/۵۴۰۶ ولتاژ ۲۰k۷ و شدت جریان ۳۰mA انجام شد.

آزمون استحکام خمشی طبق استاندارد ASTM-C11۶۱-۱۳ مدل با استفاده از دستگاه استحکام فشاری SANTAM مدل "TM-۲۰" انجام شد. اگرچه دستگاه اندازه گیری آزمون استحکام، استحکام سهنقطهای را پس از انجام آزمون گزارش می کند، اما با توجه به تعداد محدود نمونهها و همچنین جهت افزایش ضریب اطمینان، پس از آنالیز، از فرمول ۱ استحکام سهنقطهای محاسبه شد:

$$\sigma = \mathrm{\Upsilon FL}/\mathrm{\Upsilon bd}^{\mathrm{Y}} \tag{1}$$

که در این رابطه ۵، استحکام خمشی و یا سهنقطهای برحسب مگاپاسکال، F، حداکثر نیروی اعمالی در لحظه شکست نمونه برحسب نیوتن، L، فاصله بین دو سر تحت فشار در نمونه برحسب میلیمتر، d، عرض نمونه برحسب میلیمتر و d، ارتفاع نمونه برحسب میلیمتر است. مطابق استاندارد ذکر شده و شرایط قالب دستگاه (فاصله بین دو تکیه گاه)، نمونهها جهت انجام آزمون استحکام خمشی با ابعاد ^۳ mm

×۱۶ آمادهسازی شدند.

آزمایش سختی سنجی با استفاده از دستگاه سختی سنجی مدل "یونیورسال UVI" ساخت شرکت KOOPA، به روش ویکرز انجام گرفت. برای اندازه گیری سختی ابتدا نمونه های برش داده شده مانت سرد و سپس سطح نمونه های مانت شده سنباده زنی، پولیش و آزمون سختی سنجی انجام شد. برای هر نمونه حداقل ۳ بار اندازه گیری از مناطقی با فاصله معین از محل های قبلی انجام گرفت و میانگین اعداد به دست آمده کزارش شد. در این روش با استفاده از فرمول ۲ مقدار سختی نمونه ها محاسبه شد که در این رابطه Hv سختی ویکرز، F مقدار بار بر حسب Kgf و میانگین قطرهای مربع بر حسب مقدار بار بر حسب Kgf و میانگین قطرهای مربع بر حسب

$$H_{V} = 1.A\Delta F F/d^{Y}$$
 (Y)

بهمنظور اندازه گیری ثابت دی الکتریک و تانژانت اتلاف نمونه ها از دستگاه آنالیز شبکه برداری (ساخت آمریکا، مدل "EAT۶۳" شرکت Agilent technologies) استفاده شد. همه نمونه ها با ابعاد ۲۰ ۳×۲۰ جهت انجام آزمون برش داده شدند. از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) مدل "TESCAN Mira" با ولتاژ کاری میدانی (kV1۵ ساخت کشور چک به منظور بررسی مورفولوژی و چگونگی پراکندگی ذرات و همچنین بررسی ریز ساختار سطح شکست و سطح پولیش خورده قطعات تف جوشی و پوشش داده شده با طلا استفاده شد.

۳- نتایج و بحث ۳-۱- اثر دما بر چگالش و تراکم پذیری در طی فرآیند چگال نمودن نمونه های سرامیکی نیترید سیلیسیم توسط عملیات تفجوشی در حضور فاز مایع، به طور عمده نیروی محرکه برای چگال نمودن نمونه ها جیدمان مجدد ذرات ناشی از جریان مویینگی فاز مایع میباشد [۱۸] و [۲۴]. در جدول ۴ چگالی نسبی نمونه ها بعد از فرآیند تفجوشی ارائه شده است. نمونه ۲۹۶.۵۲۱.۶ در

مقایسه با سایر نمونه ها دارای بیشترین میزان چگالی نسبی (نسبت به چگالی تئوری) با مقدار ۰/۰±۲۰/۵۱٪ بوده است. کاهش چگالی در نمونه سرامیکی ۲۱.۵–۲۷۶٪ نود با ۲۱.۶ HY۶.۵۲۱ را میتوان ناشی از کاهش ضریب نفوذ با کاهش دما دانست که این امر به علت بالا بودن گرانروی فاز مایع شکل گرفته شده در دماهای پایین میباشد؛ بنابراین با کاهش دما کشش سطحی نیز کاهش یافته و با کاهش آن، نیروی مویینگی کاهش و در نتیجه فاز مایع، جریان مناسبی در بین ذرات جامد نخواهد داشت که این امر منجر به کاهش چگالی در نمونه ۲۵.۵–۲۲

با افزایش دمای تفجوشی به C°۱۸۰۰ در نمونه HY۶.۵T۱۸ چگالی نسبی کاهشیافته که علت آن را می توان به تجزیه نیترید سیلیسیم در دمای بالاتر از C°۱۷۵۰ در فشار نیتروژن اعمالی برابر با ۱ اتمسفر نسبت داد [۲۷–۲۸].

جدول (۴): چگالي نسبي نمونه هاي تفجوشي شده.

چگالی نسبی (٪)	نمونه	
90/ ±04 •/0	Y9.0T1.0	
94/±31 •/4	Y9.5T1.9	
90/±48 •/20	Y9.5T1.Y	
98/±80 •/88	Y9.0T1.A	

۳-۲- اثر دما بر ترکیبات فازی

در شکل ۲ الگوهای پراش اشعه ایکس (XRD) نمونههای تفجوشی شده در دماهای مختلف نشان داده شده است. الگوهای پراش حاصل از نمونههای مختلف، همه عناصر موجود در پودر اولیه را بهصورتهای مختلف فازی نشان می دهند و این بیانگر بلورینه شدن عناصر در ساختارهای می دهند و این بیانگر بلورینه شدن عناصر در ساختارهای می دهند و این بیانگر بلورینه شدن عناصر در ساختارهای می دهند و این بیانگر بلورینه شدن عناصر در ساختارهای می دهند و این بیانگر بلورینه شدن عناصر در ساختارهای می دهند و این بیانگر بلورینه شدن عناصر در استارهای می دهند و این بیانگر بلورینه شدن عناصر در اسختارهای می دهند و این بیانگر بلوری می ان عنام می باشد، ولی توسط پراش اشعه ایکس، فازهای شیشه می مربوط به سیستم ایر بیا سی در جدول ۵ میزان فاز بتا نیترید می سیلیسیم موجود در نمونه های سرامیکی با استفاده از رابطه معروف به گازارا – مسیر² (رابطه شماره ۳) محاسبه و گزارش شده است. الگوی پراش پرتوایکس مربوط به نمونه

سرامیکی HY۶.۵T۱.۵، نشاندهنده آن است که ریزساختار این ماده شامل دو فاز عمدهی آلفا و بتا نیترید سیلیسیم است. همچنین، در دیرگ نمونهها با افزایش دمای تفجوشی، فازهای ثانویه چون Y۵SirO۱۲N و Y۲SirOrN۴ تشکیل شده است. شدت پیکهای حاصل از پراش اشعه ایکس بیانگر آن است که در نمونه HY۶.۵T۱.۵ فازهای عمده شامل آلفا و بتا نیترید سیلیسیم است و علت آن را می توان به دمای پایین فرآیند تفجوشی نسبت داد؛ در این حالت فاز مایع به میزان کافی تشکیل نشده و در نتیجه فرآیند نفوذ، انحلال و رسوبگذاری که مکانیزم محتمل در تفجوشی سرامیکهای بر پایه نیترید سیلیسیم است بهصورت مناسب انجام نگرفته است و لذا شاهد حضور فاز آلفا در کنار فاز بتا میباشیم [۲۳]. همان طور که در شکل ۲ مشاهده می شود؛ با افزایش دمای پرس داغ از [°]C ۱۵۰۰ به [°]۱۶۰۰ پیکهای مربوط به فازهای آلفا نیترید سیلیسیم و Y_oSirO_{1t}N ناپدید شده و ظهور فاز ۲_۲SirOrN۶ و افزایش شدت پیکهای مربوط به فاز بتا نیترید سیلیسیم مشاهده می شود که بیانگر انجام هر چه بهتر فرآیند انحلال، نفوذ و رسوبگذاری و پیشرفت فرآیند تفجوشی و تبدیل هر چه بیشتر فاز آلفا نیترید سیلیسیم به بتا نیترید سیلیسیم است [۲۹]. با افزایش دمای تفجوشی به C°۱۸۰۰، همانند نمونه HY۶.۵T۱.۶، پیکهای مربوط به آلفا نیترید سیلیسیم ناپدید و پیکهای مربوط به فاز بتا نیترید سیلیسیم و YrSirOrN۶ مشاهده شده است؛ با این تفاوت که شدت پیکها نسبت به نمونه HY9.۵T۱.۶ کاهش یافته است. نتایج نشان میدهد که تغييرات دماى تفجوشي ميتواند روى تركيب فاز مرزدانهای نیترید سیلیسیم نهایی اثر بگذارد. با افزایش دمای تفجوشی تا [°]C شدت پیکهای مربوط به فازهای ثانویه مرزدانهای افزایش یافته است که می توان آن را به کریستاله شدن بیشتر فازهای مرزدانهای با افزایش دما نسبت داد [۳۰–۳۲].

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، پاییز ۱۴۰۲، شماره ۲

 $\beta = Si_N$ (wt%)

شکل (۳): مقایسه تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) حاصل از نمونههای پولیش و اچ شیمیایی شده: الف) HY۶.۵T۱.۶، ب) HY۶.۵T۱.۶، ج) HY۶.۵T۱.۶ و د) ۲۱۸۵.



۳-۴- اثر دما بر خواص مکانیکی به طور کلی، استحکام خمشی سرامیکها با چگالی نسبی ارتباط مثبتی دارد. شایان ذکر است که ریز ساختار هم برای استحکام خمشی به عنوان یک پارامتر حساس مطرح است.

$$= \frac{I_{\beta(1,1)} + I_{\beta(\gamma_1,1)}}{I_{\beta(1,1)} + I_{\beta(\gamma_1,1)} + I_{\alpha(\gamma_1,1)} + I_{\alpha(\gamma_1,\gamma_1)}}$$

جدول (۵): میزان فاز بتا نیترید سیلیسیم در نمونههای تفجوشی شده در

(٣)

دماهای مختلف.

فاز بتا نیترید سیلیسیم (٪)	نمونه	
90/40	YF.ST1.S	
~1 • •	Y9.5T1.9	
~1 • •	YF.0T1.Y	
~1	Y9.0T1.A	



شکل (۲): مقایسه الگوهای پراش اشعه ایکس نمونههای تفجوشی شده در دماهای مختلف.

۳-۳- اثر دما بر ریزساختار

در شکل ۳ تصاویر میکروسکوپ الکترونی حاصل از الکترونهای برگشتی ارائه شده است، در نمونه ۲۱.۶ HY۶.۵ نسبت به HY۶.۵T۱.۵ دانههای میله ای شکل درشت تر و کشیده تر شده و می توان بیان داشت که نمونه دارای ریزساختار دوگانه می باشد. مورفولوژی نمونههای HY۶.۵T۱.۷ و ۸۲۱۶.۵۲۱ را می توان به گرانروی پایین فاز مایع نسبت داد که در این شرایط، سرعت نفوذ یونها (نیتروژن و سیلیسیم) بالا بوده و مدت زمانی که فاز مایع تشکیل شده قابلیت حفظ خود در سطح فوق اشباع را داشته، محدود است [۳۳]، بنابراین فرآیند جوانهزنی و رشد طولی دانهها میسر نشده است. همان طور که مشاهده می شود نسبت طول به قطر ناچیز است. در شکل ۴ میانگین توزیع اندازه دانه نمونههای تف جوشی شده در دماهای مختلف ارائه شده

بهعنوان مثال مورفولوژی دانههای بلوری، اندازه و نسبت طول به قطر دانهها میتواند بر استحکام خمشی تأثیرگذار باشد.

شکل ۵ استحکام خمشی و سختی ویکرز نمونههای مختلف تفجوشی شده به روش پرس داغ را نشان میدهد. بدیهی است که خواص مکانیکی مطلوب سرامیک نیترید سیلیسیم بهوسیله ریزساختاری متشکل از دانه های کشیدهٔ میلهای شکل و در هم تنیده حاصل می شود [۳۴]. همان طور که از شکل ۵ مشخص است با تغییر دمای تفجوشی، استحکام خمشی در محدوده ۳/۴ MPa تا ۳۵۰ ± ۹/۵ MPa دچار تغییر شده است. میزان استحکام خمشی نمونهها از رابطه هال-پچ [۳۵] تبعیت مینماید و نمونه سینتر شده در دمای C°۱۵۰۰، با دارا بودن کمترین مقدار قطر متوسط (ν/۷μm) در بین سایر نمونهها، بیشترین مقدار استحکام خمشی را به خود اختصاص داده است [۳۶]. با بررسی نتایج آزمون استحکام خمشی می توان بیان کرد که نمونه HY۶.۵T۱۸ با وجود چگالی نسبی و درصد فاز بتا بالا در مقایسه با نمونه HY9.۵T۱.۵ استحکام خمشی پایین تری از خود نشان داد. دلیل این اتفاق احتمالاً به خاطر رشد افراطی دانهها در دمای تفجوشی بالا

بوده و افت خواص مکانیکی را به همراه داشته است. به طور کلی سختی سرامیک ها به ترکیبات شیمیایی، ساختار کریستالی و نوع پیوندهای شیمیایی مواد وابسته است. علاوه بر این خواص مکانیکی مواد سرامیکی به میزان تراکمپذیری آنها در مرحله تفجوشی وابسته است [۳۷]. در سرامیک نیترید سیلیسیم سختی فاز آلفا از فاز بتا بالاتر می باشد [۳۳]. سختی ویکرز نمونه های ۲۱.۶ HY۶.۵T۱۶ و ۲۱/۵۵ ۲۱۶ در مقایسه با دیگر نمونه ها به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار ۲۱/۴ HY۶.۵T۱۶ و ۲۱/۴ HY۶.۵T۱۵ است. نمونه مقدار HY۶.۵T۱۸ با داشتن بیشترین فاز آلفا و کمترین مقدار نسبت طول به قطر دانه انتظار می رفت دارای بالاترین میزان سختی باشد اما به دلیل میزان چگالی نسبی پایین به حداکثر مقدار سختی خود نرسید. لذا علت بالا بودن سختی ویکرز

در نمونه HY۶.۵T۱.۶ در مقایسه با سایر نمونهها را می توان به بالا بودن مقدار چگالی نسبی بعد از فرآیند تفجوشی (۴/ + ۹۷/۵۱) نسبت داد.

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر خواص مکانیکی سرامیکها فاکتور "نسبت طول به قطر دانه " است. عموماً استحکام سرامیکهای نیترید سیلیسیم با افزایش نسبت طول به قطر دانههای کشیده شده فاز β افزایش می یابد [۸۳]. هم چنین با فرض چگالش بالا در نمونهها می توان گفت نسبت طول به قطر کمتر، سختی بالاتری به همراه خواهد داشت [۳۳]. در مقطر کمتر، سختی بالاتری به همراه خواهد داشت [۳۳]. در متوسط اندازه دانههای نمونههای تفجوشی شده در دماهای مختلف ارائه شده است. با توجه به جدول ۶ می توان بیان نمود که با افزایش نسبت طول به قطر دانهها، استحکام خمشی و سختی روند معنی داری از خود نشان نمی دهد و برای توجیه این رفتار نوسانی مطابق آنچه گفته شد می بایست فاکتورهای دیگری همانند متوسط اندازه دانه، درصد فاز بتا و

جدول ۶. خواص مکانیکی، نسبت طول به قطر دانهها و متوسط اندازه دانههای نمونههای تفجوشی شده در دماهای مختلف.

سختی (HV)	استحکام خمشی (MPa)	متوسط اندازه دانه (μm)	نسبت طول به قطر دانهها	نمونه
1800 ± 89	22.4 4 4 5	•/Y	4/77	Y9.0T1.0
1280 ± 21/4	$\mathbf{r}\mathbf{v}\mathbf{\cdot}\pm\mathbf{d}/\mathbf{v}$	•/٧۶	4/29	Y9.5T1.9
1090 ± 40/0	$\texttt{rag} \pm \texttt{r/r}$	1/34	5/42	Y9.5T1.Y
$101 \cdot \pm 47/7$	480 ± 4/1	۱/۴	8/21	X9.0T1.



3-4- اثر دما بر خواص دیالکتریک در سرامیکهای پایه نیترید سیلیسیم مقدار، توزیع، اندازه دانه و مورفولوژی ذرات آلفا و بتا فاکتوری قطعی در تعیین خواص نهایی قطعات تولید شده هستند. اساساً خواص دىالكتريك سراميكها به ريزساختار آنها بستگى دارد. در حالت كلي، اتلاف دىالكتريك متأثر از غلظت ناخالصىها، نواقص شبکهای، چگالی و بلورینگی فاز ثانویه است [۳۹-۴۰]. در شکل ۶ تغییرات ثابت دیالکتریک (الف) و تانژانت اتلاف (ب) با تغییر دمای تفجوشی در فرکانس GHz در نمونه های مختلف ارائه شده است. با توجه به شکل (۶ الف) مي توان بيان نمود كه با افزايش دماي تفجوشي، ثابت دیالکتریک از ۴/۵ به ۹/۲ افزایش یافته است. در همین راستا، پارک و همکارانش ^۷ [۴۱] در پژوهش خود نشان دادند که افزایش اندازه دانه، منجر به افزایش در خواص دىالكتريك سراميكهاى نيتريد سيليسيم به همراه افزودني YrOr از طریق پرس داغ شده است. علاوه بر تأثیر اندازه دانه بر خواص دىالكتريك، مىتوان به تأثير فاز آلفا و بتا نيتريد سیلیسیم اشاره کرد. فاز بتا نیترید سیلیسیم دارای ثابت دىالكتريك بالاترى نسبت به آلفا نيتريد سيليسيم است؛ بنابراین با افزایش دمای تفجوشی و افزایش میزان فاز بتا نیترید سیلیسیم در نمونههای تفجوشی شده ثابت دىالكتريك افزايش يافته است. علاوه بر موارد گفته شده، ثابت دىالكتريك به درصد تخلخل و چگالى نمونهها وابسته است و طبق رابطه ذیل ثابت دیالکتریک با میزان تخلخل موجود در نمونه نسبت عکس دارد و با افزایش میزان تخلخل (كاهش چگالي)، ميزان ثابت دىالكتريك كاهش مىيابد.

$$\varepsilon = \varepsilon,^{1-p} \tag{(f)}$$

در این رابطه. ٤، گذردهی الکتریکی مربوط به مادهٔ ۱۰۰٪ متراکم و p میزان درصد تخلخلها است. با توجه به روند افزایشی ثابت دیالکتریک و مقادیر چگالی نسبی نمونهها نمی توان ارتباطی بین این فاکتور و ثابت دیالکتریک

استنباط کرد و اندازه دانه و ترکیب فازی گزینه های بهتری برای توجیه این رفتار به حساب می آیند. یکی از موارد تأثیر گذار بر تانژانت اتلاف دی الکتریک، ریز ساختار و اندازه دانه است؛ به طوری که با افزایش اندازه دانه، میزان تانژانت اتلاف افزایش می یابد. با توجه به شکل ۶-ب، با افزایش دمای تف جوشی از Ω°۱۵۰۰ به ۲°۱۸۰۰ طول متوسط دانه ها از ۲۳ /۰۰ به ۲۳ /۱۴ و تانژانت اتلاف نیز از ۲۹۰/۰ به ۲۲/۰ افزایش یافته است. مکانیزم فیزیکی حاکم بر تأثیر اندازه دانه بر اتلاف دی الکتریک این است که میدان

بر یر رو بر رو بر یا ی رو جمع شدگی پیوندهای سطحی کریستال (بلور) با انقباض و جمع شدگی پیوندهای سطحی دچار تغییر میشود. کاهش اندازه دانه منجر به افزایش میدانهای بلوری (میدان اعمالی توسط هر بلور به اطراف) شده و متعاقباً منجر به کاهش خواص دی الکتریک میشود. از سوی دیگر، بر طبق نتایج گزارش شده توسط سایر محققین، اتلاف دی الکتریک فاز بتا به صورت قابل توجهی، بزرگ تر از فاز آلفای ریز و درشت است و با نتایج به دست آمده در این یژوهش مطابقت دارد.



شکل (۴): تغییرات خواص دیالکتریک با تغییر متوسط اندازه دانه در فرکانس ۴۰ GHz: الف) ثابت دیالکتریک و ب) تانژانت اتلاف.

9, pp. 1819–1880, Mar. 1.1., doi: 1.1.19/j.msea.1..9.99.

[δ] X. J. Liu, Z. Y. Huang, Q. M. Ge, X. W. Sun & L. P. Huang, "Microstructure and mechanical properties of silicon nitride ceramics prepared by pressureless sintering with MgO-Al_xO_x -SiO_x as sintering additive", J. Eur. Ceram. Soc, vol. Y δ , no. 1¢, pp. YY δ Y-YY δ 4, Y.· δ , doi:1.1.19/j.jeurceramsoc.Y.·¢.· Λ .Y δ .

[γ]S. Guo, N. Hirosaki, Y. Yamamoto, T. Nishimura & M. Mitomo, "Dependence of fracture stress on applied stress rate in a Yb₇O₇-SiO₇-doped hotpressed silicon nitride ceramic", J. Mater. Res, vol. 19, no. 11, pp. **TYAF-TY91**, **T**··1, doi: 1.100V/JMR.**T**··1..**FFA**.

[v] P. F. Becher & et al, "Microstructural Design of Silicon Nitride with Improved Fracture Toughness: I, Effects of Grain Shape and Size", J. Am. Ceram. Soc, vol. \wedge 1, no. 11, pp. $\uparrow \land \uparrow 1 - \uparrow \land \uparrow \uparrow$, Jan. $\uparrow \cdot \cdot \diamond$, doi: $1 \cdot .1111/j.11\diamond1 - \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow .144 \land .tb \cdot \uparrow v \cdot \uparrow .x.$

[Λ] V. Sharma, S. Nemat-Nasser & K. S. Vecchio, "Effect of grain-boundary phase on dynamic compression fatigue in hot-pressed silicon nitride", J. Am. Ceram. Soc, vol. Λ 1, no. 1, pp. 179–179, 199 Λ , doi: 1.111/j.1101-7919.199 Λ .tb.777.f.x.

[9] I. Bar-On, F. I. Baratta & K. Cho, "Crack stability and its effect on fracture toughness of hotpressed silicon nitride beam specimens", Journal of the American Ceramic Society, vol. v9, no. 9. pp. $\gamma \gamma \cdot \cdot -\gamma \gamma \cdot \cdot , 199\%$. doi: $1 \cdot \cdot 1111/j \cdot 1101 \gamma 91\% \cdot 199\% \cdot 109\% \cdot 1000\%$

[۱۰] ح. صدلاله و ۱. نورمحمدی، "اثر فرآیند پرس گرم بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ نانو بلورین فاینمت"، مواد و فناوریهای پیشرفته، دوره ۴، شماره ۱، صفحه ۵۴–۴۷، ۱۳۹۴.

در پژوهش حاضر اثر دماهای مختلف تفجوشی (C°۱۸۰۰ و °C، ۱۷۰۰، °C، ۱۶۰۰، °C) بر تراکمپذیری و ریزساختار و بهینهسازی خواص مکانیکی و دیالکتریک سرامیکهای نیترید سیلیسیم با افزودنی ۲٬O۳ تهیه شده به روش پرس داغ به مدت ۴h تحت فشار پرس MPa بررسی شده است. بالاترین نسبت چگالی واقعی به تئوری مربوط به نمونه ۲۶.۵۲۱.۶ و برابر با ۹۷/۵۱٪ میباشد. طبق الگوي پراش حاصل از اشعه ايکس و رابطه گازارا- مسير، در نمونه های Y9.۵T۱.۶ و Y۶.۵T۱.۷ همه فاز آلفا به بتا تبدیل شده است و در نمونه ۲۶.۵۲۱.۵ میزان تبدیل ۹۵/۴۵٪ بوده است. نمونه ۲۶.۵۲۱.۵ با دارا بودن کمترین مقدار قطر متوسط (ν/۷μm) در مقایسه با سایر نمونهها، بیشترین مقدار استحکام خمشی ۹/۵MPa <u>+</u> ۵۵۰ را به خود اختصاص داد. سختی ویکرز نمونههای HY۶.۵T۱.۶ و HY۶.۵T۱۸ در مقابسه با دیگر نمونهها به ترتیب دارای بیشترین و کمترین ۱۸۶۰ ± ۲۱/۴ HV و ۱۸۶۰ ± ۴۳/۳ HV است. مقدار با افزایش اندازه متوسط دانهها و کاهش نسبت فازی $\beta/lpha$ در اثر افزایش دمای تفجوشی، ثابت دیالکتریک و تانژانت اتلاف نمونه ها در فرکانس ۱۰GHz به ترتب از ۴/۵ به ۹/۲ و از ۰/۰۹۹ به ۲۲/۰ افزایش یافته است.

۵- مراجع

۴- نتیجه گیری

[1]H. Kaya, "The application of ceramic-matrix composites to the automotive ceramic gas turbine", Compos. Sci. Technol, vol. $\delta 4$, no. ϑ , pp. $\delta \vartheta 1 - \delta \eta'$, May 1944, doi: $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 7 \cdot \delta (4 \cdot 4) \cdot \cdots 1 \cdot 2 \cdot \cdots$

[r]M. H. Bocanegra-Bernal & B. Matovic, "Mechanical properties of silicon nitride-based ceramics and its use in structural applications at high temperatures," Mater. Sci. Eng. A, vol. ΔYV , no. Ceram. Int, vol. 47, no. 19, pp. 14941–1494v, Dec. Y. 19, doi: 1.1.19/j.ceramint.Y. 19. 9...1.

[14] Q. G. Jiang & et al, "Influence of powder characteristics on hot-pressed Si_rN_r ceramics", Sci. Sinter, vol. F4, no. 1, pp. $\Lambda 1 - \Lambda 4$, Y-1V, doi: 1...YY4 Λ /SOS1V-1.. Λ J.

 $[\gamma \cdot]$ H. Seiner & et al, "Elastic properties of silicon nitride ceramics reinforced with graphene nanofillers", Mater. Des, vol. $\lambda \gamma$, pp. $\gamma \gamma \Delta - \gamma \lambda \cdot$, $\gamma \cdot \gamma \Delta$, doi: $1 \cdot .1 \cdot 1 \gamma / j$.matdes. $\gamma \cdot 1 \Delta \cdot \lambda \cdot \gamma \gamma$.

[γ 1] J. Wippler, S. Fünfschilling, F. Fritzen, T. Böhlke & M. J. Hoffmann, "Homogenization of the thermoelastic properties of silicon nitride", Acta Mater, vol. $\Delta 4$, no. 1Δ , pp. $\hat{\gamma} \cdot \gamma 4 - \hat{\gamma} \cdot \gamma \Lambda$, $\gamma \cdot 11$, doi: $1 \cdot 1 \cdot 1 \hat{\gamma}/j$.actamat. $\gamma \cdot 11 \cdot \hat{\gamma} \cdot 11$.

[$\gamma\gamma$] P. Šajgalik, J. Dusza & M. J. Hoffmann, "Relationship between Microstructure, Toughening Mechanisms, and Fracture Toughness of Reinforced Silicon Nitride Ceramics", J. Am. Ceram. Soc, vol. vA, no. 1., pp. $\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma$, Oct. 1996, doi: 1.1111/j.1161-7919.1996.tb.A.T1.x.

 $[\Upsilon r]$ B. Ma, Y. Tang & C. Deng, "Effects of Al_xO_x-Y_yO_y/Yb_yO_x additives on microstructures and mechanical properties of silicon nitride ceramics prepared by hot-pressing sintering", Int. J. Appl. Ceram. Technol, May Y•YY, doi: 1.1111/jac.1F•A1.

 $[\Upsilon F]$ Q. Dai, D. He, F. Meng, P. Liu & X. Liu, "Materials Science in Semiconductor Processing Dielectric constant, dielectric loss and thermal conductivity of Si_rN_r ceramics by hot pressing with CeO_Y – MgO as sintering aid", Mater. Sci. Semicond. Process, vol. 1Y1, no. August Y.Y., p. 1.2F.9, Y.Y1, doi: 1.1.19/j.mssp.Y.Y.1.2F.9.

[$\gamma \delta$] S. Dahms, F. Gemse, U. Basler, H. P. Martin & A. Triebert, "Diffusion joining of silicon nitride ceramics," Est. J. Eng, vol. $\lambda \delta$, no. \mathfrak{F} , p. $\mathfrak{r} \cdot \mathfrak{1}$, $\mathfrak{r} \cdot \mathfrak{9}$, doi: $\lambda \cdot \mathfrak{r} \lambda \mathfrak{r} / \mathfrak{1} \mathfrak{r} \cdot \mathfrak{9}$.

 $[\Upsilon \ensuremath{\mathfrak{I}}]$ Y. Song, L. Liu, D. Liu, X. Song & J. Cao, "Low-temperature bonding of Cu on ${\rm Si}_{\tau}N_{\tau}$ substrate

[۱۱] ص. منافی و م. خواجه لو، " تولید و ارزیابی خواص نانو کامپوزیت زمینه سرامیکی B۴C/BN توسط فرآیند پرس گرم"، نانو مواد، دوره ۱۰. شماره ۳۳، صفحه ۵۵–۵۳، ۱۳۹۶.

[1Y] H. Liang & et al, "YB_YC_Y: A new additive for fabricating Si_YN_F ceramics with superior mechanical properties and medium thermal conductivity", Ceram. Int, vol. \$%, no. \$, pp. $\delta Y \$ \$ - \delta Y \$ \$$, Mar. $\$ \cdot \$ \cdot$, doi: $1 \cdot . 1 \cdot 1 \% / j$.ceramint. $\$ \cdot 1 \$. . \cdot 1 \% / j$.

[1π] Y. Han & et al, "Optimum sintering temperature of high quality silicon nitride ceramics under oscillatory pressure", Ceram. Int, vol. 4π , no. 4π , pp. 444-444, Apr. 1.14, doi: 1.1.14/j.ceramint.1.14.

[1^{r}] J. Yang, J. Yang, S. Shan, J. Gao & T. Ohji, "Effect of Sintering Additives on Microstructure and Mechanical Properties of Porous Silicon Nitride Ceramics", J. Am. Ceram. Soc, vol. A4, no. 17, pp. "AFT-TAFA, Dec. $7 \cdot \cdot 9$, doi: $1 \cdot .1111/j.1001-$ 7419.7.1.9.174F.x.

[14] W. Liu, W. Tong, X. Lu & S. Wu, "Effects of different types of rare earth oxide additives on the properties of silicon nitride ceramic substrates", Ceram. Int, vol. 4, no. 4, pp. 17479-17447, Jun. $7\cdot14$, doi: $1\cdot.1\cdot19/j$.ceramint. $7\cdot14...7.196$.

[1v] S. C. Luo, W. M. Guo, K. Plucknett & H. T. Lin, "Improved toughness of spark-plasma-sintered Si_rN_r ceramics by adding HfB_r ", Ceram. Int, vol. rv, no. r, pp. $Av_1v - Av_1v$, Mar. rv_1v , doi: $1\cdot 1\cdot 1r/r$, i.e.

[1A] W. Liu, W. Tong, R. He, H. Wu & S. Wu, "Effect of the $Y_{\tau}O_{\tau}$ additive concentration on the properties of a silicon nitride ceramic substrate", [rr] H. Ding, Y. Hu, X. Li, Z. Zhao & H. Ji, "Microstructure, mechanical properties and sintering mechanism of pressureless-sintered porous Si_rN_r ceramics with YbF_r-MgF_r composite sintering aids", Ceram. Int, vol. rr, no. r, pp. rada-radr, Feb. r.r., doi: 1.1.19/j.ceramint.r.14..4.11F.

[r_{0}] A. Kumar, R. S. Rana, R. Purohit, K. K. Saxena, J. Xu & V. Malik, "Metallographic Study and Sliding Wear Optimization of Nano Si_rN_r Reinforced High-Strength Al Metal Matrix Composites", Lubricants, vol. 1., no. 4, Y.YY, doi: 1., $r_{r_{1}}$.

[r_{9}] J. Xu, K. Hattori, Y. Seino & I. Kojima, "Microstructure and properties of CrN/Si_rN₇ nanostructured multilayer films", Thin Solid Films, vol. $r_{1}r_{1}$, no. r, pp. $r_{1}r_{2}-r_{1}r_{2}$, $r_{1}r_{1}$, doi:https://doi.org/1.1.19/S. $r_{1}-r_{2}$.

[rv] F. Hu, T. Zhu, Z. Xie & J. Liu, "Effect of composite sintering additives containing non-oxide on mechanical, thermal and dielectric properties of silicon nitride ceramics substrate", Ceram. Int, vol. fv, no. 1., pp. 18970–18977, May 7.11, doi: 1.1.19/j.ceramint.Y.Y1..1.YYF.

[r_{Λ}] C. E. Lee, M. J. Kim, Y. J. Park, J. W. Ko, H. N. Kim & S. Bae, "The effect of silicon particle size on the characteristics of porous sintered reaction bonded silicon nitride", Int. J. Refract. Met. Hard Mater, vol. 1.1, no. July, p. 1.4979, 7.71.

[**r**9] A. R. Von Hippel, "Dielectric Materials and Applications", Artech House, 1996.

 $[f \cdot]$ C. Gabriel, S. Gabriel, E. H. Grant, E. H. Grant, B. S. J. Halstead & D. Michael P. Mingos, "Dielectric parameters relevant to microwave dielectric heating", Chem. Soc. Rev, vol. rv, no. r, pp. $r_1r_-r_1r_f$, 199A, doi: $1 \cdot 1 \cdot r_9/AArvr_1r_Z$.

۶- پینوشت

by using Ti/Cu thin films", Mater. Lett, vol. rr, p. rrrr, r. r, doi: https://doi.org/1.1.19/j.matlet.r.rrrrr.

[$\gamma\gamma$] H. Singh, M. D. Hayat, H. Zhang & P. Cao, "The decomposition of Si_rN_F in titanium and its effect on wear properties," Wear, vol. $\gamma\gamma$ - $\gamma\gamma$, pp. $\Lambda\gamma$ - $\gamma\delta$, Feb. γ - $\gamma\eta$, doi: γ - $\gamma\gamma$ / β /j.wear. γ - $\gamma\Lambda$. $\gamma\gamma$ - $\gamma\phi$.

[YA] G. Cotin & et al, "A Confinement-Driven Nucleation Mechanism of Metal Oxide Nanoparticles Obtained via Thermal Decomposition in Organic Media", Small, vol. 1A, no. Y., p. YY...FIF, May Y.YY, doi: 1...Y.Y/Smll.Y.YY..FIF.

[Υ] C. C. Ye, W. Q. Wei, X. Fu, C. H. Wang & H. Q. Ru, "Effect of sintering activation energy on Si_rN_r composite ceramics", Ceram. Int, vol. Υ A, no. Υ , pp. Υ ADI- Υ ADV, Υ . Υ Y, doi:https://doi.org/1.1.19/j.ceramint. Υ Y1.11.. Υ 1.

[\mathfrak{r} ·] A. H. Nassajpour-Esfahani, A. Alhaji, M. R. Hahftbaradaran-Esfahani, R. Emadi & A. Bahrami, "Oxidation and phase transformation behaviors of Si_rN_r-xMgAl_rO_r (· < x < \mathfrak{r} · wt.%) nanocomposites in vacuum, air, and nitrogen atmospheres", Ceram. Int, vol. \mathfrak{r} v, no. \mathfrak{r}), pp. \mathfrak{r} · Λ · \mathfrak{r} - \mathfrak{r} · Λ) \mathfrak{r} , \mathfrak{r} · \mathfrak{r}), doi:https://doi.org/)·.)·) \mathfrak{r} /j.ceramint. \mathfrak{r} · \mathfrak{r}).· \mathfrak{r} ?

[r_1]C. Ye & et al, "Investigation on thermal conductivity and mechanical properties of Si_rN_r ceramics via one-step sintering", Ceram. Int, vol. r_V , no. r_r , pp. $r_rr_0r_-r_rr_r$, r_rr_1 , doi: https://doi.org/1.1.19/j.ceramint. r_rr_1 .

[rr] Y. Wang & et al, "Synthesis of monodisperse and high-purity α -Si_rN_r powder by carbothermal reduction and nitridation", Adv. Powder Technol, vol. rr, no. λ , pp. $r1 \cdot 1 - r1 \cdot \rho$, $r \cdot r1$, doi:https://doi.org/1.1.19/j.apt.7.71.. ρ ..rr.

[**TT**] Z. Liu & et al, "Liquid-Phase-Assisted Catalytic Nitridation of Silicon and In Situ Growth of &alpha-Si_rN_r", Materials (Basel), vol. 10, no. 1V, Y•YY, doi: 1.773./ma10197.VF.

- [۵] Jiang et al
- [9] Gazara-Meseir
- [V] Park et al

- [1] Hot Press
- [Y] Spark Plasma Sintering
- [*****] Hot Isostatic Pressing
- [۴] Liu et al